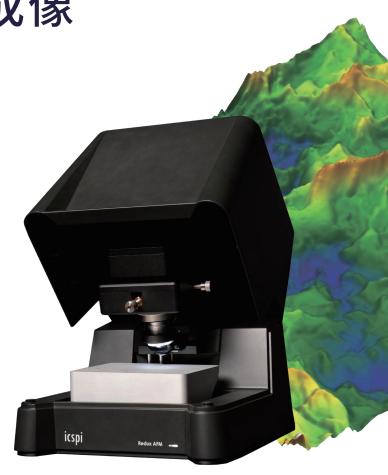


REDUX 原子力显微镜

轻松实现纳米级成像

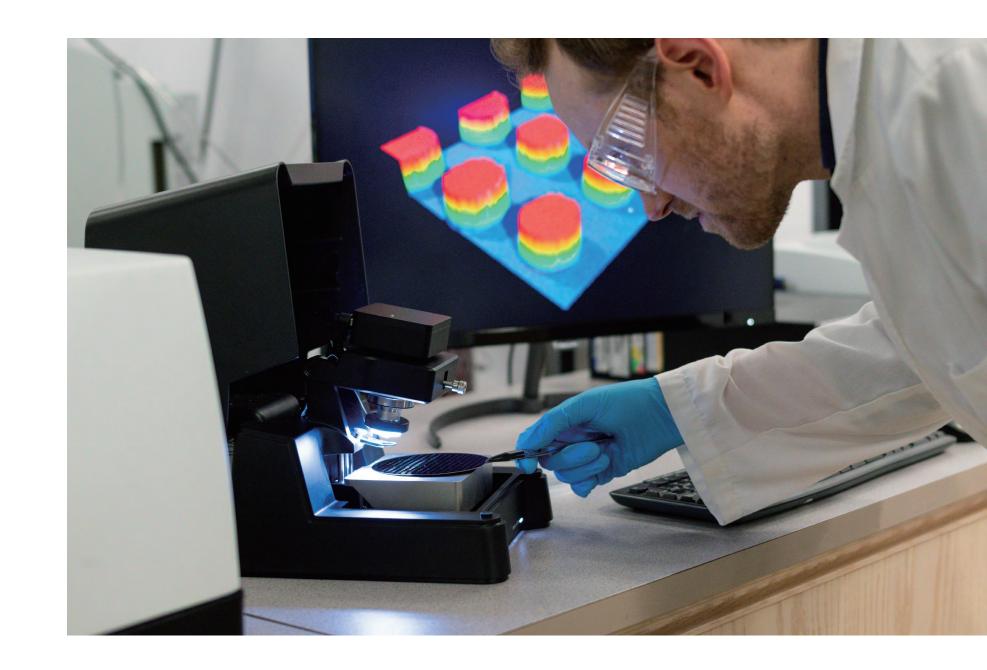
- 台式 AFM 的最快数据获取时间
- 自动配置、接近和扫描
- 电动 XY 和 Z 平台,可轻松定位样品
- 集成光学显微镜
- 易于使用、耐用的 AFM 芯片



我们的使命

ICSPI 的使命是

通过强大、自动化和直观的方式扩展纳米级测量的应用成像工具。



;

我们所做的

ICSPI 设计和制造快速、强大且易于使用的原子力显微镜系统,用于研究、教育和质量控制。



我们的故事

ICSPI 成立于 2007 年,旨在为每个人带来快速、强大且易于使用的纳米级计量技术。由于传统仪器的多功能性差、复杂性和速度慢,ICSPI 通过直观的 AFM 系统重新设定了对纳米级成像的期望。

关于 Redux AFM

使用 Redux AFM,在台式机上轻松采集亚纳米精度的 3D 形貌数据。几分钟内即可获得形貌、粗糙度、薄膜厚度、颗粒尺寸等定量数据。

- 几分钟内收集纳米级的 3D 图像
- 轻松设置:无需激光对准的系统
- 一键自动操作,数秒内完成
- 无需更换硅探针:耐用、易用的 AFM 芯片

REDUX AFM

更高水平的 自动化

- ✓ 自动配置接近和扫描
- 电动 XY 和 Z 轴平台
- ✓ 集成光学显微镜
- ✓ 环境覆盖



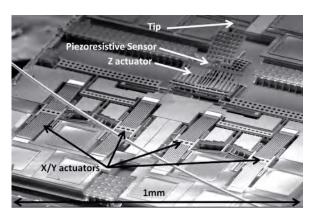
芯片上原子力显微镜技术

芯片上的原子力显微镜

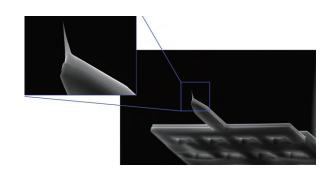
Redux AFM 采用 ICSPI 的芯片 AFM 技术,使 AFM 快速、直观且维护成本低。精确 XYZ 扫描仪和定位传感器集成到单个 1mm² 芯片上。

芯片上的原子力显微镜 (AFM-on-a-chip) 采用集成压阻传感器,可实现无需激光对准的操作级从尖端到样品的全自动一键式接近。

我们的 AFM 芯片采用最先进的微机电系统 (MEMS) 技术使 Redux 速度快、易于使用并且运行顺利。



扫描电子显微镜(SEM) 片上原子力显微镜设备图像



类金刚石碳的 SEM 图像 悬臂末端的探针

长寿命 AFM 探针

ICSPI AFM 探针采用耐用材料制成。

凭借独特的、兼容的芯片上原子力显微镜机制和悬臂,使用寿命可达 1000次以上,且无明显磨损。





英特尔微芯片(铜基二氧化钛切片)的 AFM 形貌扫描图,数字表示扫描次数。图像质量(横向分辨率)在超过 1000 次扫描后仍保持稳定。

Redux AFM 规格

扫描

扫描类型	形貌、相位		
最大扫描尺寸	20μm x 20μm		
最小扫描尺寸	300nm x 300nm		
垂直扫描范围	20μm		
本底噪声	< 0.5nm rms		

分辨率和速度

快速扫描(128px)	16s
常规扫描(256px)	80s
高分辨率扫描(512px)	5min
最大分辨率	1024 x 1024 像素

样品

样品平台区域	125mm x 95mm
最大样品高度	20mm
最大样品重量	250g

电动 XY 平台

样品定位范围(XY)	12mm x 12mm	

集成光学显微镜

物镜	10x, 0.25NA
视野	1.4mm x 0.8mm
分辨率	1920 x 1080 FHD 视频输出
样品照明	集成 LED 照明

系统尺寸和重量

尺寸(长 x 宽 x 高)	23.2cm x 22.0cm x 24.6cm
重量	4kg

软件和 I/O

通信	USB	
操作系统	Windows 10 和 11	
数据输出	gsf, tsv, png	

电源

电源供给	Ⅱ类(双叉)	
输入	100-240 VAC ~ 50/60 Hz	
输出	12v 直流电,3A	

比较

	ReduX AFM	传统 AFM	SEM
空气中操作	✓	✓	Х
自动方法	✓	Χ	N/A
安装时间	5 min	1-2 周	1-2 周
数据获取时间	3 min	1 h	30 min-1 h
成本	\$	\$\$\$	\$\$\$\$
每次扫描费用台式	\$	\$\$	\$\$
训练时间	1 hr	12+ hrs	12+ hrs
无需激光对准	\checkmark	Χ	X
常规电源和 USB	✓	X	X
易于处理的芯片	✓	X	N/A
维护成本低	✓	X	X
3D 图像	✓	✓	Х
亚纳米分辨率	✓	✓	Х
非导电样品	✓	✓	X

我们的仪器值得信赖 来自世界各地的研究人员、工程师 和教育工作者





















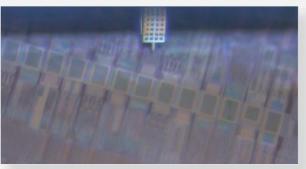




3D 纳米级扫描只需 3 步

1. 轻松导航

集成光学显微镜和电动 XY 载物台



2. 轻松导航

一键式自动,尖端和样品接近可在 10s 内完成



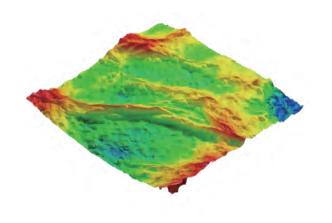
3. 快速扫描

只需一分钟即可完成常规扫描

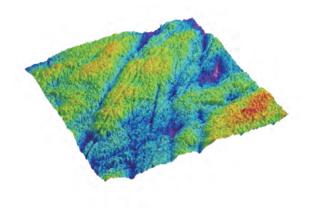


REDUX AFM

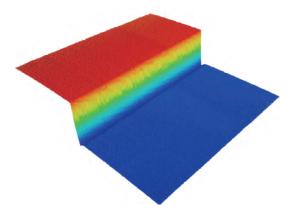
功能



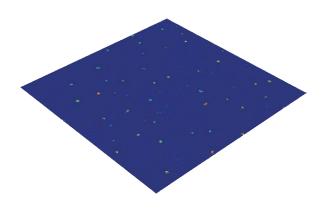
形貌图 收集丰富的高分辨率 3D 定量数据



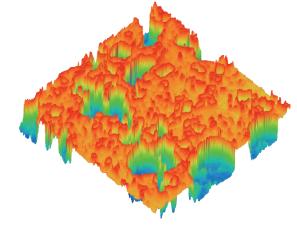
粗糙度 超越线轮廓和 Ra:获取整 个区域的 3D 定量数据



厚度 精确侧拉薄膜厚度和 台阶高度



粒子 确定颗粒大小、形状和 分布



相位成像 发现材料中成分的空 间分布

复纳 Scientific Instrument



Keep in Touch

联系我们



400 857 8882



info@phenom-china.com



www.phenom-scientific.com







飞纳电镜公众号

复纳科技公众号

产品小程序

复纳科学仪器(上海)有限公司

上海市闵行区申滨路 88 号虹桥丽宝广场 T5 办公楼 705 室

苏州办事处

苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际研发社区 启动区 10 号 A 座 108 室

北京办事处

北京市海淀区西四环北路 119 号四季慧谷数字园区 A 座一层 118 室

广州办事处

广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋大道87号C栋601-602单元

成都办事处

成都市高新区锦云东三巷 1 号金融麦田 C106